填充式方钴矿化合物 CeOs₄Sb₁₂近藤相互作用的 非弹性中子散射研究

杨昌平^{1,2)†} 周智辉¹)王浩¹)K. Iwasa²)M. Kohgi²)

1) 湖北大学物理学与电子技术学院,武汉 430062)
2) 日本東北大学物理系,日本仙台 981-0935)
(2006年4月16日收到2006年8月7日收到修改稿)

 $CeOs_4 Sb_{12}$ 晶体中由于导电电子与 Ce^{3+} 4fⁱ 电子之间存在 c_{-f} 杂化作用导致费米面附近存在能量间隙.这种 c_{-f} 近藤相互作用和能量间隙是理解 $CeOs_4 Sb_{12}$ 物理性质,如近藤绝缘体行为、 Ce^{3+} 磁矩在低温下猝灭以及重费米性等 电、磁性质的关键.当用 LAM-D 中子谱仪对粉末 $CeOs_4 Sb_{12}$ 进行测量时,可以得到不同温度下 $CeOs_4 Sb_{12}$ 的非弹性中 子散射谱.结果表明 $CeOs_4 Sb_{12}$ 中存在近藤相互作用,其作用强度为 3.1 meV,证实了 $CeOs_4 Sb_{12}$ 为近藤绝缘体.中子测 量得出 $CeOs_4 Sb_{12}$ 德拜温度为 317 K.

关键词:非弹性中子散射,填充式方钴矿,近藤绝缘体 PACC:7530M,7127,7520H,6112F

1.引 言

三元稀土化合物 RT₄X₁₂(R 代表稀土元素,T 代表过渡族金属,X代表磷族元素)从方钴矿 (skutterudite)结构(如 CoAs,)通过 R 原子填充晶体 结构中二十面体空隙位衍生而来,为体心立方结构, 空间群为 Im 3¹².由于 R 原子在由最近邻十二个 X 原子组成的二十面体原子笼(cage)中作非相干性 振动 填充式方钴矿 RT₄X₁₂在保持良导电性的同 时 其热导性却较差 因而具有较大的 Seebeck 系数 和热电转换效率 成为具有潜在实用价值的热电材 料^[3-6]. RT₄ X₁₂的物理性质主要取决于填充位稀土 离子 4f 电子的自由度和能量状态,未填满壳层 4f 电 子与晶体导电电子之间的杂化作用导致 4f 电子的 非局域化巡游性质 这种杂化作用与异位 R 离子 4f 电子之间的 RKKY(Ruderman-Kittle-Kasuya-Yoshida) 超交换作用之间的竞争,导致 RT₄ X₁₂系变化多样的 物理性质和丰富的磁、电有序电子基态,如重费米 性[78]、超导电性[9.10]、磁有序结构[11]、绝缘体-金属 相转变^[12]以及非费米液体性等^[13]. Ce 填充 $RT_{4}X_{12}$

除 CeRu₄Sb₁₂基态为非费米液体外,其他化合物均表 现出磁性半导体特征,其磁、电性质主要决定于 Ce³⁺ 中 4f^t 电子与导电电子相互作用(c-f 相互作用) 所形成的能隙大小.CeFe₄P₁₂由于晶胞体积最小,c-f 相互作用最强 具有最大的半导体能量间隙 $\Delta E/k_{
m R}$ $\approx 1500 \text{ K}^{[14]}$. CeOs₄Sb₁₂在低温下表现出中等程度的 重费米特征 宏观电阻率测量表明 CeOs₄Sb₁₂为近藤 绝缘体 通过拟合低温部分电阻率随温度的变化曲 线 推算出在费米面附近 CeOs₄Sb₁,存在约为 10 K 的 能隙^[15].CeOs₄Sb₁₂的直流磁化率随温度的变化曲线 可用+3 价 Ce 离子局域化单离子模型较好解释^[15]. 但以上对 CeOs₄Sb₁,磁、电性质和相互作用的认识是 基于宏观物性测量及相应实验数据的模型拟合,为 了对 Ce³⁺ 4f¹ 磁性电子的性质及磁相互作用(如晶 场作用、4f 电子与导电电子之间的近藤相互作用等) 作直接的观察测量,我们用非弹性中子散射方法研 究了 CeOs₄Sb₁₂样品,以便从原子尺度分析 CeOs₄Sb₁₂ 所表现出的宏观电、磁性质.

2.实验方法

CeOs₄Sb₁₂单晶用 Sb 助熔剂方法生长.所用原料

[†] E-mail:cpyang@hubu.edu.cn

均为高纯度, Ce(99.99%), Os(99.999%), Sb (99.999%)按Ce:Os:Sb = 1:4:20的原子比混合 后 密封在抽高真空(10⁻⁴ Pa)的石英管中,放入炉 内在 960 ℃温度下处理 100 h 后以 1 ℃/h 的速度降 温至 650 ℃.然后关掉电源,迅速降至室温,再用王 水 HCl: HNO₃ = 1:1)溶解除去过剩的 Sb 后得到 CeOs₄Sb₁₂单晶样品.晶体生长详情见文献 16].助熔 剂法生长单晶有两个主要优点,一是化合物单晶体 可以在远低于各单质组分元素熔点以下结晶生长。 由于结晶温度低 生长出的单晶体缺陷较少 晶体内 热应力小,二是由于熔体可以吸纳来自组分元素引 入的杂质 故晶体可在纯净的环境中生长以减少晶 体内的缺陷,生长出较完美的单晶体,粉末样品非弹 性中子散射实验在日本 KEK 的以脉冲中子为源的 LAM-D 谱仪上完成, 收集中子过程中, 出射中子能 量保持恒定值 4.6 meV ,散射角为 85°, 所用的粉末 样品通过将 CeOs₄Sb₁₂ 单晶粉碎磨细后获得 ,粉末用 量为 45 g.

3.结果及讨论

由于声子、自旋波、晶场作用、c-f相互作用等固体元激发和磁相互作用的强度大多在 1—100 meV, 所以非弹性中子散射是直接观察测量这些相互作用 的最有力的研究手段.图1示出粉末 CeOs₄Sb₁₂样品 用 LAM-D 谱仪在不同温度下测量的中子散射谱,图 中的谱线强度已扣除了来自 Al 样品盒和冷冻机造 成的本底散射.由于所用的是粉末样品,所以谱线强 度包含了 CeOs₄Sb₁₂中所有因素对中子的非弹性散 射贡献.从图1可以看出,谱线强度 / 随温度变化明 显 随温度的提高而上升.这反映出声子的散射特 征 因为温度越高,晶体激发的声子数越多,对中子 的散射作用也就越强.晶格振动所产生的非弹性中 子微分散射截面可写为

$$\left(\frac{\mathrm{d}^{2}\sigma}{\mathrm{d}\Omega\,\mathrm{d}E}\right)_{\mathrm{inc}+1} = \frac{\sigma_{\mathrm{inc}}}{4\pi} \frac{k'}{k} \frac{3N}{2M} \mathrm{exp}(-2W)$$
$$\times \frac{(\kappa \cdot \boldsymbol{e}_{\mathrm{s}})^{2}}{\omega} Z(\omega) n_{\mathrm{s}} + 1$$

式中 σ_{inc} 为非相干原子散射截面 ,k 为入射中子波 矢模值 ,k' 为出射中子波矢模值 ,M 为原子质量 , exp(-2W)为德拜 - 沃勒因子 $,\kappa$ 为散射矢量 $,e_s$ 为 极化矢量 $,Z(\omega)$ 为声子能态密度.玻色因子

$$n_{\rm s} + 1 = \{ \exp(\hbar\omega/k_{\rm B}T) - 1 \}^{-1} + 1$$

其中, $\hbar\omega$ 为中子能量损失, $k_{\rm B}$ 为玻尔兹曼常数,T为温度.



图 1 CeO₅₄Sb₁₂粉末样品在不同温度下的中子散射谱线 出射 中子能量(*E*_f)保持恒定值 4.6 meV 散射角 85°.图中谱线已扣除 由 Al 样品和冷冻机产生的本底散射

图 2 为谱线强度 *I* 值除以玻色因子 $n_s + 1$ 扣 除温度对散射强度影响后的结果.从图 2 可以看出, 当能量大于 3.8 meV 时,谱线强度与温度变化基本 无关.这表明能量 *E* > 3.8 meV 的谱线部分,其强度 与玻色因子成正比,散射强度主要由晶格声子引起. 温度为 300 K 的谱线强度比 *T* = 4,70,150 K 的强 度都稍低,可能是由于 300 K 时德拜-沃勒因子较其 他温度要大.此外,从图 1 和图 2 还可以看到,谱线 在能量 *E* = 8,17,25 meV 位置出现较明显峰形,这 可能是由晶格与中子的单声子过程引起.类似的声



图 2 扣除玻色因子后,谱线强度在不同温度下随能量的变化 图中的谱线由图 1 谱线强度除以玻色因子 $(exp(h_{B}T)-1)^{-1}$ +1 得到

子散射谱也曾在 CeRu₄Sb₁₂粉末样品的中子散射中 观测到并讨论过^[17].另一方面,在扣除玻色因子影 响后,图 2 谱线在能量 E = 3.1 meV 附近仍出现与 温度变化相关的峰形,与声子散射相反,其强度随温 度降低而升高,反映出磁性散射的特点.CeOs₄Sb₁₂在 低温下的磁矩非常小,并且自旋波散射强度随温度 的升高而升高,故可以排除该峰形由磁有序和自旋 波引起的可能性.再者,对 CeOs₄Sb₁₂的磁化率测量 表明 Ce³⁺的晶场作用大约为 28.1 meV,远大于图 2 给出的 3.1 meV.

综上可知,图 2 中在 3.1 meV 附近出现的散射 峰应来源于 Ce^{3+} 4f⁴ 电子与晶体导电电子的 c-f 交 换作用.这与文献 15 通过拟合 $CeOs_4Sb_{12}$ 宏观电阻 率测量曲线得到能隙约为 1 meV 在量级上相符.因 此,我们的中子散射测量结果直接表明 $CeOs_4Sb_{12}$ 为 近藤绝缘体,是 $CeOs_4Sb_{12}$ 中 Ce^{3+} 4f⁴ 电子与导电电 子存在杂化作用的直接证据.

为了更清楚地显示近藤相互作用能隙的存在, 图 3 给出了图 2 中 T = 4 K 与 T = 150 K 两条谱线 相减的结果.从图 3 可以看出,在扣除声子散射贡献 (T = 150 K)后,散射谱仅在 3.1 meV 附近出现明显 的峰形.图 3 中能量低于 2 meV 时,谱线强度陡然上 升则是由于 CeOs₄ Sb₁₂ 中的非相干弹性散射所致.高 温时,中子散射强度主要源于晶格振动所激发的声 子的贡献.对粉末样品而言,扣除玻色因子后的高温 散射谱线反映了声子的状态密度,即在单位能量内 的声子数随能量的变化关系.由于样品的质量、体积 有限,样品所包含的原子数和晶胞数确定,所以晶格 的振动模式数为一有限值,这对声子能量的最大取 值进行了限定,故当能量超过一定值时,声子数和态 密度为零.从图 1 和图 2 中我们可以看到,当能量大 于 27.4 meV 时谱线强度迅速降为零,所以 E = 27.4 meV 是声子能量的最大取值,能量所对应的温 度为 CeOs₄Sb₁₂的德拜温度 $\theta_{\rm D}$ = 317 K,对应的德拜 频率为 $\omega_{\rm D}$ = 4.16×10¹³ s⁻¹.中子散射结果与X射 线对 CeOs₄Sb₁₂所测德拜温度 $\theta_{\rm D}$ = 375 K 在量级 上一致^[18],与其他一些填充式方钴矿化合物(如 La_{0.75} Fe₃CoSb₁₂)的德拜温度 $\theta_{\rm D}$ = 307 K 相近^[19].



图 3 低温(T = 4 K)谱线与高温(T = 150 K)谱线的强度差 能 量 E = 3.1 meV 出现的强度源于 CeOs₄Sb₁₂中 Ce³⁺ 4f⁴ 与晶体导 电电子之间的近藤相互作用贡献.中子测量结果与文献[13]计 算值(1 meV)在量级上一致

4. 结 论

利用 LAM-D 脉冲中子谱仪对粉末填充式方钴 矿化合物 $CeOs_4Sb_{12}$ 进行了测量,得到不同温度下 $CeOs_4Sb_{12}$ 的非弹性中子散射谱.结果表明, $CeOs_4Sb_{12}$ 中存在 c-f 近藤相互作用,其作用强度约为 3.1 meV.中子测量同时得出 $CeOs_4Sb_{12}$ 的德拜温度为 317 K.

- [1] Jeitschko W, Braun D 1977 Acta Crystallogr. B 33 3401
- [2] Braun D J , Jeitschko W 1980 J. Less-Common Met. 72 147
- [3] Sales B C , Mandrus D , Williams R K 1996 Science 272 1325
- [4] Mahan G , Sales B Sharp J 1997 Phys. Today 50(3)43
- [5] Tang X F, Chen L D, Goto T et al 2001 Acta Phys. Sin. 50 1560 (in Chinese)[唐新峰、陈立东、后藤孝等 2001 物理学报 50 1560]
- [6] Luo P F, Tang X F, Xiong C et al 2005 Acta Phys. Sin. 54 2403 (in Chinese)[罗派峰、唐新峰、熊 聪等 2005 物理学报 54 2403]
- [7] Aoki Y, Namiki T, Ohsaki S et al 2002 J. Phys. Soc. Jpn. 71 2098
- [8] Viennois R, Terki F, Errebbahi A et al 2003 Acta Phys. Polon. B 34 1221
- [9] Bauer E D , Frederick N A , Ho P C et al 2002 Phys. Rev. B 65 R100506
- [10] Aoki Y, Tsuchiya A, Kanayama T et al 2003 Phys. Rev. Lett. 91 67003
- [11] Danebrock M E, Evers C B H, Jeischko W 1996 J. Phys. Chem. Solids 57 381

- [12] Sekine C, Uchiumi T, Sirotani I et al 1997 Phys. Rev. Lett. 79 3218
- [13] Takeda N , Ishikawa M 1992 Physica B 259 92
- [14] Sato H , Abe Y , Okada H et al 2000 Phys. Rev. B 62 15125
- [15] Bauer E D, Slebarski A, Freeman E J et al 2001 J. Phys. : Condens. Matter 13 4495
- [16] Torikachvili M S ,Chen J W , Dalichaouch Y et al 1987 Phys. Rev. B 36 8660
- [17] Adroja D T, Park J G, McEwen K A et al 2003 Phys. Rev. B 68 94425
- [18] Cao D, Bridges F, Chesler P et al 2004 Phys. Rev. B 70 094109
- [19] Yang L , Wu J S , Zhang L T 2004 Chin . Phys . 13 516

Kondo interactions in the CeOs₄Sb₁₂ skutterudite studied by inelastic neutron scattering

Yang Chang-Ping¹⁽²⁾[†] Zhou Zhi-Hui¹) Wang Hao¹) K. Iwasa²) M. Kohgi²)

 $1\$) Faculty of Physics and Electronic Technology , Hubei University , Wuhan 430062 ,China)

2 Department of Physics , Tohoku University , Sendai 981-0935 , Japan)

(Received 16 April 2006 revised manuscript received 7 August 2006)

Abstract

The energy gap near Fermi surface due to the hybridization of $Ce^{3+} 4f^{4}$ and conduction electrons is the key to understand the physical properties of the $CeOs_4Sb_{12}$ compound, such as Kondo insulating behavior, moment quench of Ce^{3+} at low temperatures and the characteristics of heavy fermion. In this work, inelastic neutron scattering spectra of powder $CeOs_4Sb_{12}$ sample were collected at different temperatures using LAM-D neutron spectrometer at KEK pulsed neutron source. The result indicates that the $CeOs_4Sb_{12}$ skutterudite is a Kondo insulator with a c-f interaction of 3.1 meV. The Debye temperature is determined as 317 K.

Keywords : inelastic neutron scattering , filled skutterudite , Kondo insulator PACC : 7530M , 7127 , 7520H , 6112F

[†] E-mail : cpyang@hubu.edu.cn